附件2：

2020年第二批半导体材料行业标准项目计划

| 序号 | 计划编号 | 项目名称 | 标准  性质 | 制修订 | 代替标准号 | 采标  情况 | 项目周期/个月 | 技术归口单位 | 主要起草单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务来源：《工业和信息化部办公厅关于印发2020年第二批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》（工信厅科函[2020] 181号），2020年7月22日 | | | | | | | | | |
| 1 | [2020-0718T-YS](http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YSCPZT07052020) | 碳化硅单晶中痕量杂质元素含量的测定 辉光放电质谱法 | 推荐 | 制定 |  |  | 24 | 全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会 | 国合通用测试评价认证股份公司、国标（北京）检验认证有限公司、南京国盛电子有限公司、北京天科合达半导体股份有限公司 |
| 2 | [2020-0719T-YS](http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YSCPZT07042020) | 高纯镓化学分析方法 第3部分：痕量杂质元素含量的测定 辉光放电质谱法 | 推荐 | 制定 |  |  | 24 | 全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会 | 国合通用测试评价认证股份公司、国标（北京）检验认证有限公司、南京金美镓业有限公司 |
| 3 | [2020-0720T-YS](http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YSCPZT07062020) | 六氯乙硅烷中杂质含量的测定 电感耦合等离子体质谱法 | 推荐 | 制定 |  |  | 24 | 全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会 | 洛阳中硅高科技有限公司、新特能源股份有限公司、亚洲硅业（青海）股份有限公司 |